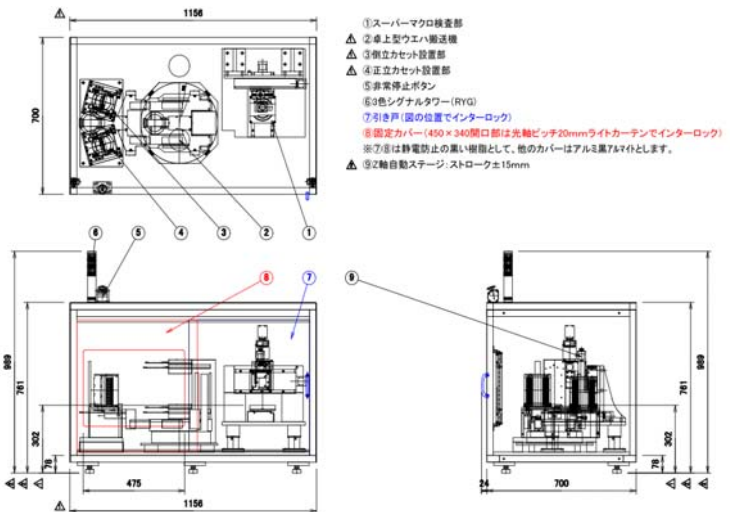
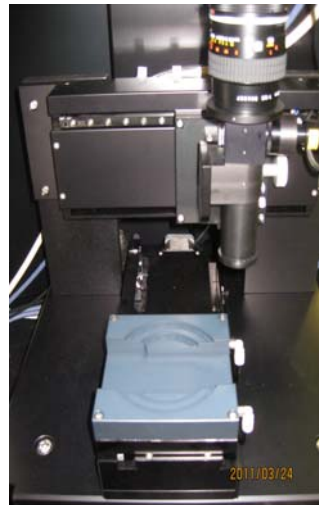


## 全自動S I C検査装置



### 概要

**全自動全数全面測定**が可能なスーパーマクロ検査装置になります。  
 測定ワークを、カセットに装着しておけば、サンプル全面を全自動で測定いたします。  
 今までの装置は、大変高価で、装置も大きく、取り扱いが大変でしたが、小型低価格を、実現いたしました。  
 S I Cや、G a nの内部欠陥を超高速で検査でき、(1視野1秒以下) サファイア基板の傷検査も可能です。  
 測定サンプルサイズも標準でφ300mm迄対応ですが、PDFなどの大型基板にも、対応いたします。  
 カセット数も、ご要望に応じ表面、裏面、検査後の3カセット対応でクリーンルーム内での設置も可能です。  
 サンプル面に触れない、エッジランプ式も選べます。

### 装置仕様

スーパーマクロ部	
形式	SM-30
視野サイズ	最大φ30mm
カメラ	130万画素CMOS
レンズ	55mmマイクロニッコール
照明	高輝度LED (PC調光)
フォーカス	輝度追従型 (自動)
使用OS	Windows XP、または7
検査時間	1視野1秒以下

#### アプリケーション

- S I Cや、G a nの内部のマイクロパイプ
- サファイア基板やシリコン基板の表面検査
- 基板の反りや凹凸、応力歪み
- 熱スリップの検査
- マイクロクラック
- 内部の脈理や、気泡検査
- B G研磨痕の検査や評価
- 各種のウエハーやF P Dの内部や表面検査

#### 搬送ロボット部 (一例)

被搬送物	最大φ150mmウエハー
動作範囲	アームストローク (R軸) 240mm
旋回角度 (θ軸)	340度
上下ストローク (Z軸)	200mm
搬送速度	R軸 240mm/0.8sec θ軸 180度/0.8sec Z軸 200mm/0.8sec
ステージ部	自動X軸、Y軸、Z軸

### 測定例

